## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平10-284547

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		徽別記号		FΙ				
H01L	21/60	3 1 1		H01L	21/60		311T	
B 2 3 K	1/00	3 3 0		B 2 3 K	1/00		330B	
	35/30	3 1 0			35/30		310C	
C 2 2 C	19/05			C 2 2 C	19/05		D	
	29/08				29/08			
			審查請求	未請求 請	求項の数 1	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番り	<del>)</del>	特願平9-93817		(71) 出席	人 000000	6264		
					三菱マ	テリア	ル株式会社	
(22) 出願日		平成9年(1997)4月11日		東京都千代田区大手町1丁目5番1号				
				(72)発明	オ 大沢	雄三		
					埼玉県	大宮市	北袋町1丁目	297番地 三菱
					マテリ	アル株	式会社総合研	究所内
				(72)発明	猪 西山	昭雄		
					埼玉県	大宮市	北袋町1丁目	297番地 三菱
					マテリ	アル株	式会社総合研	究所内
				(74)代理	1人 弁理士	: 當田	和夫(外	1名)

#### (54) 【発明の名称】 ICチップのリード材ポンディング用圧接工具

#### (57)【要約】

【課題】 基体割れやろう付け剥離の発生のない1 C チップのリード材ポンディンク用圧接工具を提供する。 解決手段】 基体の表面に多時晶がイヤモンド膜を気 相合成所出してなる工具本体を、ろう材を用いてヒーター内蔵のシャンク部に接合した構造形形成が見たして、 、上記工具本体の基体を、分散形形成成分として、炭 化タングステン:90~98重量%を含有し、残りが結 合相形成成分としてのC o と不可避不機物からなる相成 を有する超慢金で構成し、また、上記ろう特を、A 8:5~15重量%、P:1~10重量%を含有し、残 りがC u と不可避不緩物からなる組成を有するC u 合金 で構成し、きなに、上記シャンが密を、C P:10~2 5重量%、F e:5~15重量%を含有し、残りがN i と不可適不続物からなる組成を有するN i 合金で構成する。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体の表面に多結晶ダイヤモンド膜を気 相合成析出してなる工具本体を、ろう材を用いてヒータ 一内蔵のシャンク部に接合した構造の圧接工具におい

1

#### 上記工具本体の基体を、

分散相形成成分として、炭化タングステン:90~98 重量%、を含有し、残りが結合相形成成分としてのCo と不可避不締物からなる組成を有する紹硬合金で構成 L.

また、上記ろう材を、

Ag: 5~15重量%、

P : 1~10重量%、を含有し、残りがCuと不可避 不締物からなる組成を有するCu合金で構成し、さら に、上記シャンク部を、

Cr:10~25重量%。

Fe:5~15重量%、を含有し、残りがNiと不可避 不純物からなる組成を有するNi合金で構成したことを 特徴とする基体割れやろう付け剥離の発生のないICチ ップのリード材ポンディング用圧接工具。

### 【発明の詳細を説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、実用に際して、 残留応力の経時的蓄積がきわめて少なく、したがって大 型化しても残留応力が原因の基体割れやろう付け剥離の 発生のない I C チップのリード材ポンディング用圧接て 旦に関するものである。

#### [00002]

【従来の技術】従来、一般に、ICチップの製造に際し て、例えば図1の概略説明図で示されるように、ICチ 30 するCu合金で構成し、さらに、同シャンク部を、C ップの表面に 前記ICチップ表面の上方位置に横方向 所定間隔配置された多数のCu合金などのリード材の先 端部を、前記リード材と同じ配置でICチップ表面に形 成されたAu - In合金(はんだ材)などのバンプを介 して、内蔵したヒーターで500~1000℃に加熱さ れた圧接工具で圧下するすることにより接合(ボンディ ング) することが行われている。また、ICチップのリ ード材のボンディングに用いられる圧接工具としては、 例えば特許第2520971号明細書に記載されるよう に、工具本体を、0.5~5mmの厚さを有し、かつS 40 i C基熔結体やSia Na基熔結体。さらにAIN基度 結体などからなる基体の表面に、熱フィラメント法やマ イクロ波プラズマCVD法、さらに高周波プラズマCV D法などの気相合成法を用いて5~300μmの平均層 厚の多結晶ダイヤモンド膜を形成したもので構成し、こ の工具本体を、コバール合金やインバー合金、さらにW C基超硬合金などからなるヒーター内蔵のシャンク部 に、各種のAg合金やCu合金などからなるろう材を用 いて接合した構造のものが知られている。 [00003]

【発明が解決しようとする課題】一方、近年の半導体装 置の高集積化はめざましく、これに伴い、ICチップは 大面積化し、したがってこれの製造に用いられる圧接工 具は大型化する傾向にあるが、上記の従来圧接工具はじ め、その他多くの圧接工具においては、これを大型化す ればするほど、その実用に際して、圧接工具を構成する 工具本体の基体に割れが発生し易くなるばかりでなく、 基体とシャンク部のろう付け部に剥削が発生し易くな り、使用寿命の短命化が避けられないのが現状である。 10 これは作業態様、すなわち500~1000℃に加熱し

た圧接工具を常温のリード材に圧接し、このリード材を 介してバンプを溶融温度に加熱してボンディングを行な う工程の繰り返しに原因するものと考えられ、この場 合、圧接工具、特にこれを構成する基体は急激を加熱冷 却の繰り返しを受けることになるが、同時に発生した残 留応力が経時的に蓄積し、かつこの基体中の残留応力は 圧接工具が大型化するほど大きく、ついにはこの蓄積し て大きくなった残留応力が基体割れやろう付け剥離を引 き起こすものと解される。

20 [0004] 【課題を解決するための手段】そこで、本発明者等は、 上述のような観点から 残留応力の発生が少なく かつ 残留応力の経時的蓄積のない圧接工具を開発すべく研究 を行なった結果、圧接工具の基体を、分散相形成成分と して、炭化タングステン(以下、WCで示す):90~ 9.8%を含有し、残りが結合相形成成分としてのCoと 不可避不締物からなる組成を有する部硬合金で構成し、 また、同ろう材を、Ag:5~15%、P:1~10%

を含有し、残りがCuと不可避不純物からなる組成を有

r:10~25% Fe:5~15%を含有し、残りが Niと不可避不締物からなる組成を有するNi合金(以 上重量%、以下%は重量%を示す)で構成すると、この 結果の圧接工具は、上記基体が残留応力の発生を抑制 し、かつ上記ろう材が残留応力の蓄積を抑制するように 作用するので、これを大型化しても、基体制れやろう付 け剥離の発生なく、上記シャンク部によって確保された すぐれた耐熱性と相まって、著しく長期に亘っての使用 が可能となるという研究結果が得られたのである。

【0005】この発明は、上記の研究結果に基づいてな されたものであって、基体の表面に多結品ダイヤモンド 膜を気相合成析出してなる工具本体を、ろう材を用いて ヒーター内蔵のシャンク部に接合した構造の圧接工具に おいて、上記工具本体の基体を、分散相形成成分とし て、炭化タングステン:90~98%、を含有し、残り が結合相形成成分としてのCoと不可避不締物からなる 組成を有する超硬合金で構成し、

また、上記ろう材を、

Ag: 5~15%

50 P : 1~10%、を含有し、残りがCuと不可避不純

3

物からなる組成を有するCu合金で構成し、さらに、上 記シャンク部を、

Cr:10~25%.

Fe:5~15%,

を含有し、残りがNiと不可避不純物からなる組成を有 するNi合金で構成してなる、基体割れやろう付け剥離 の発生のないICチップのリード材ポンディング用圧接 工具に特徴を有するものである。

【0006】なお、この発明の圧接工具において、通常 ヤモンド隈の厚さは、前記基体の厚さを 2~5mmとし た状態で、平均層厚で30~100µmとするのが望ま しく、また前記多結晶ダイヤモンド膜の形成に際して は、その前処理として、前記基体に、(a)表面部の結 合相形成成分除去のための表面エッチング処理、(b) 表面傷付け処理、(c)70~150気圧のAr雰囲気 中、1300~1550℃の温度に所定時間保持の条件 での表面部WC粒の粗大化熱処理、以上(a)~(c) のうちの少なくともいずれかの表面処理を施して、多結 晶ダイヤモンド膜の密着性向上を図るのがよい。

【0007】つぎに、この発明の圧接工具を構成する基 体 ろう材 お上びシャンク部の組成を上記の通りに定 めた理由を説明する。

#### (1) 基体

基体を構成する超硬合金のWCは良好な熱伝導性を有 1. かつ残留店力の発生を抑制する作用があるが その 割合が90%未満では、前記作用に所望の効果が得られ ず、さらに結合相形成成分の割合が相対的に多くなり過 ぎて変形し易くなり、一方その割合が98%を越えると 結合相形成成分の割合が相対的に少なくなり過ぎて焼結 30 性が低下し、所望の確度を確保することができなくなる ことから、その割合を90~98%と定めた。

【0008】(2)ろう材

(a) Ag

Ag成分には、ろう材の融点を下げ、もって流動性を増 して少量のろう材で満足なろう付けを可能ならしめる作 用があるほか、ろう材の主成分であるCu成分との共存 において、残留応力を吸収し、もって残留応力の経時的 蓄積を抑制すると共に、加熱されたシャンク部から基体 への熱伝達を促進する作用があるが、その含有量が5% 40 未満では前記作用に所望の効果が得られず、一方その含 有量が15%を越えると、ろう付け部の強度が低下する ようになることから、その含有量を1~15%、望まし くは7~13%と定めた。

[00091(b) P

P成分には、ろう材の融点を下げると共に、これ自体の 強度を向上させ、もってろう付け部の強度を向上させる 作用があるが、その含有量が1%未満では前記作用に所 望の効果が得られず、一方その含有量が10%を載える

その含有量を1~10%、望ましくは3~8%と定め

【0010】(3)シャンク部

シャンク部には、内蔵するヒーターによって自身を50 0~1000℃に加熱し、これにろう付けされた工具本 体の温度を同じ温度に保持する役割があるので、すぐれ た耐熱性と耐酸化性を具備することが求められる。した がって、シャンク部を構成するNi合金のCr成分は、 耐熱性および耐酸化性を向上させる成分として含有する の気相合成法によって基体表面に形成される多結晶ダイ 10 が、その割合が10%未満では、所望の耐熱性および耐 酸化性を確保することができず、一方その割合が25% を越えると、強度が低下するようになることから、その 割合を10~25%と定めた。また、同じくFe成分に は、韓度を向上させる作用があるが、その割合が5%未 満では、所望の強度を確保することができず、一方その 割合が15%を越えると、耐熱性および耐酸化性に低下 傾向が現れるようになることから、その割合を5~15 %と定めた。

[0011]

20 【発明の実施の形態】この発明の圧接工具を実施例によ り具体的に説明する。まず、基体を製造する目的で、原 料粉末として、0.5~3μmの範囲内の平均粒径を有 する細粒WC粉末、3~10µmの範囲内の平均粒径を 有する粗粉WC粉末、および平均粒径:1,2 umCo 粉末を用意し、これら原料粉末をそれぞれ表1に示され る配合組成に配合し、ボールミルで7.2時間混式混合 し、乾燥した後、1 t o n / c m2 の圧力で圧粉体にプ レス成形し、この圧粉体を1×10<sup>-3</sup>torrの真空 中、1450~1550℃の範囲内の所定の温度に1時

間保持の条件で焼結し、この結果の超硬合金を機械加工 にて長さ: 1 2 mm×幅: 4 mm×厚さ: 2.5 mmの 寸法とすることにより超硬基体を製造し、ついで前記超 硬基体の表面に、(a)5%硝酸水溶液中に5分間浸漬 の表面エッチング処理(以下、表面処理aと云う)、

(b) 平均粒径: 10 µmのダイヤモンドパウダーを分 散含有させたアルコール中での10分間の超音波表面傷 付け処理(以下、表面処理bと云う)、(c)100気 FのAr雰囲気中、1480℃に1時間保持の表面部W C粒の粗大化熱処理(以下、表面処理cと云う)、以上 表面処理a~cのうちの少なくともいずれかの表面処理 を表1に示される組み合わせで施した後、気相合成法の 1種である通常のマイクロ波プラズマCVD装置に装入

反応ガス組成: CH4 (流量: 10cc/min) + H 2 (流量:500cc/min)、

雰囲気圧力:50 torr.

マイクロ波出力:2kw、 基体温度:900℃、

の条件で気相合成を行い、上記基体のそれぞれの表面に と、ろう付け部が急激に脆化するようになることから、 50 同じく表1に示される平均層厚の多結晶ダイヤモンド膜 を形成することにより工具本体A~Gをそれぞれ製造し

【0012】また、黒鉛るつぼで、それぞれ表2に示さ れる組成のAg合金溶湯を調整し、インゴットに鋳造 し、これを熱間圧延にて厚さ: 0.2mmの熱延板と この熱硬板に冷間圧硬を施して厚さ:0.05mm のろう材a~gをそれぞれ製造した。

【0013】さらに、同じく黒鉛るつぼで、それぞれ表 3に示される組成のNi合金溶湯を調整し、これを精密 鋳造(ロストワックス法)した後、機械加工することに 10 膜の先端面を縦:15mm×横:5mmに加工し、かつ より上記基体の表面寸法と同じ寸法のろう付け面をもっ たシャンク部アーオをそれぞれ製造した。

【0014】ついで、上記の工具本体、ろう材、および シャンク部を、表与に示される組み合わせでセットし、 Ar雰囲気中、850~950℃の範囲内の所定温度に 10分間保持の条件で工具本体をろう材を介してびシャ ンク部にろう付け接合することにより本発明圧接工具1 ~7をそれぞれ製造した。

【0015】また、比較の目的で、工具本体として、い ずれも多結晶ダイヤモンド膜の平均層厚が50μmであ 20 の圧接工具を、600℃に加熱した状態で、10kgの るが、基体が、それぞれSis N4 -5%Y2 Os -3 %Al。O。からなる組成を有するSi。N。基礎結体 (以下、工具本体Hと云う)、A1N-3%Y2 O3-2%CaOからなる組成を有するA1N基焼結体(以 下、工具本体 I と云う)、およびSiC-2%B4 Cか らなる組成を有するSiC基億結体(以下 丁旦本体.J\*

\*と云う)、また、シャンク部としてFe-19.7%N i-19、3%Co-0、95%Mnからなる組成を有 するFe-Ni-Co合金のシャンク部(以下、シャン ク部カと云う)、並びにろう材として、Cu-32%Z n-30%Agからなる組成を有するCu-Zn-Ag 合金のろう材(以下、ろう材まと云う)を用いる以外は 同一の条件で比較圧接工具1~3をそれぞれ製造した。 【0016】この結果得られた本発明圧接工具1~7お よび比較圧接工具1~3について、多結晶ダイヤモンド 同表面組さをRmax で O. 8 m に研磨した状態で、以 下に示す条件で加速耐久試験を行った。すなわち、加速 耐久試験は、図1のICチップおよびリード材に代っ て、無酸素組およびA1合金(Si: 2%含有)からな り、いずれも表面: 20mm×10mm、厚さ: 10m mの寸法をもち、表面に1個の表面寸法が0.5mm× 5mmにして、高さが3mmの突起が10個づつ長 さ方向に沿って2列配列配置された水冷ボックスを用 い、この水冷ボックスの突起配設面に対して、上記各種 荷重で1サイクルを8秒とし、このうちの3秒を圧接時 間とした条件で行い。 使用寿命に至るまでのサイクル数 を測定した。これらの測定結果を表4に示した。 [0017]

6

基体の配合組成(重量%) 多結晶ダイ 表面処理 ヤモンド牌 種 別 W C 記号 の平均層厚 Co 粒粗 217 (um) 30.0 60.0 残 37.5 я В 4n nl 52.5 14 a → b 45.0 I С 50.0 43.5 c 65.0 具 D an ni 34.5  $c \rightarrow a \rightarrow b$ 85.7 \* Ε 50.5 45.5 雅 ь 47.3 体 70.0 27.0 秩 c → a 84.6 180. pl28. p c → b 68.5

【表1】

[0018] 【表2】

7								
種	34	成分組成(重量%)						
12	45	Ag	P	C u +不純物				
	а	5. 4	3. 5	溅				
5	ь	7. 8	7. 4	独				
3	c	10.3	9. 6	共				
,	d	12.7	1. 4	溅				
材	e	1 3. 5	4. 5	풙				
	f	14.6	6. 2	残				

\*【0019】 【表3】

10

+

	P.:	献:	分組成	(重量%)
理	90	C r	Fe	Ni+不純物
۶	7	12.5	9. 8	残
+	1	17.5	10.6	残
ν	Ď	24.8	8. 5	践
,	Ξ	10.4	5. 3	践
部	#	16.7	14.5	践

9								1		
		租会せ			加速耐久試験結果					
穫	31		ろう材 シャンク部 記号 記号	使用寿命に サイクル数	寿	÷				
				記号		無酸素鋼 ボックス	W	Œ		
*	1	A	a	7	36985	29756	E #	厚耗		
発	2	В	ь	1	41235	31282	E #	摩鞋		
ij	3	С	c	त	38564	30164	正常	摩托		
Æ	4	D		I	39256	29756	正常	原耗		
接	5	E	f	,	35762	27689	正常	摩托		
I	6	F	ь	7	38657	30124	正常	摩托		
Ą	7	G	е	ı	36726	30895	正常	摩托		
比較	1	н	8	ħ	9542	5 2 6 8	基体	2.5		
圧接	2	ı	ž	ħ	8534	4892	ろう付	け剥削		
I A	3	J	2	ħ	8245	5214	基体	电裂		

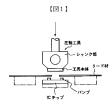
## [0021]

【発明の効果】表4に示される結果から、本発明圧接工 具1~7は、上記の通りの工具本体、ろう材、およびシ 30 化しても基体割れやろう付け剥離の発生なく、長期に亘 ャンク部の組み合わせによって残留応力の発生が抑制さ れ、かつ残留応力の経時的蓄積が阻止されることから、 基体割れやろう付け剥離の発生なく、すぐれた耐久性を 長期に亘って発揮するのに対して、比較圧接工具1~3 においては、いずれも基体割れまたはろう付け剥離が原\*

\* 因で比較的短時間で使用寿命に至ることが明らかであ る。上述のように、この発明の圧接工具は、これを大型 っての使用を可能とするので、半導体装置の高集積化に

十分満足に対応するものである。 【図面の簡単な説明】

【図1】圧接工具の使用態様を示す概略説明図である。



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup> 識別記号 FΙ

C 3 0 B 29/04 C 3 O B 29/04

A C H 0 1 L 21/603 H 0 1 L 21/603